01;08 Теория и расчет гибридного резонаторного фильтра на поверхностных акустических волнах с повышенным внеполосным подавлением

© В.Ф. Дмитриев

Закрытое акционерное общество "Авангард–Элионика", 195271 Санкт-Петербург, Россия e-mail: elionica@rol.ru

(Поступило в Редакцию 27 марта 2002 г. В окончательной редакции 23 апреля 2002 г.)

На основе модифицированных уравнений для связанных мод разработана теория фильтров на продольных резонансных модах. Проведено сопоставление результатов теории и эксперимента. Предложенная топология гибридного резонаторного фильтра на поверхностных акустических волнах, использующего как продольные резонансные моды, так и резонансные моды лестничной структуры, обеспечивает повышенное внеполосное подавление.

Введение

В последние годы в связи с бурным развитием мобильной связи большой интерес возник к фильтрам, использующим резонаторы на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Основным достоинством таких фильтров являются весьма малые вносимые потери (1-4 dB) при приемлемом внеполосном подавлении (25-60 dB). Данные качества являются весьма привлекательными для использования фильтров в системах связи, в частности в мобильных телефонах. Большинство мобильных телефонов различных стандартов связи (в том числе GSM, PCS, PCN и т.д.) в качестве элементов частотной селекции используют различные типы резонансных фильтров на ПАВ. Основными типами резонансных фильтров на ПАВ являются следующие: лестничные фильтры с использованием резонаторов на ПАВ [1], фильтры на поперечных резонансных модах [2] (NCRF) и фильтры на продольных резонансных модах [3] (DMSF). Каждому из перечисленных выше типов фильтров присущи свои достоинства и недостатки. Основным недостатком лестничных фильтров является сравнительно небольшое внеполосное подавление при отстройке от центральной частоты на несколько полос пропускания. Фильтры на поперечных резонансных модах могут быть реализованы только на материалах с низким коэффициентом электромеханической связи и поэтому имеют небольшую относительную полосу частот (не более 0.15%). Кроме того, TCRF-фильтры требуют элементы согласования. Фильтры на продольных резонансных модах имеют справа на частотной зависимости коэффициента передачи "плечо", уровень которого для фильтра, имеющего два полюса входной проводимости, находится на уровне -10...-15 dB. Поэтому такие фильтры требуют последовательного включения двух или трех звеньев, входная проводимость фильтра имеет при этом 4 или 6 полюсов соответственно.

В [4] был предложен и экспериментально проверен способ уменьшения уровня "плеча" на частотной характеристике DMSF-фильтра путем включения емкости

между входом и выходом фильтра. В [5] выполнен приближенный расчет и проведено сопоставление результатов расчета и эксперимента при введении дополнительной емкости. Однако включение дополнительной емкости между входом и выходом фильтра наряду с уменьшением уровня "плеча" приводит и к уменьшению уровня общего внеполосного подавления фильтра.

В данной работе на основе модифицированных уравнений для связанных мод предложенных в [1], построена теория фильтров, использующих продольные резонансные моды. Проведено сопоставление результатов расчета и эксперимента. Предложен топологический метод устранения "плеча" DMSF-фильтра путем использования вместо второго звена DMSF-фильтра лестничного фильтра на основе резонаторов на ПАВ, выполненного на той же подложке.

Модифицированный СОМ-метод

Обычно используемая СОМ-теория (смотри, например, [6]), основанная на выводе и последующем решении системы неоднородных дифференциальных уравнений неоправданно усложняет расчет устройств на ПАВ. В рамках такой теории затруднен учет таких факторов, как изменяющийся период структуры, аподизация, неоднородное распределение поверхностного заряда на электродах структуры. Все перечисленные факторы достаточно просто могут быть учтены в рамках модифицированного СОМ-метода, оперирующего элементарным звеном структуры (одним электродом ВШП встречно-штыревого преобразователя или отражающей структуры). Кроме того, данный метод более перспективен с точки зрения дальнейшего усложнения исходной модели структуры. Параметры структуры на ПАВ в целом (ВШП отражающей структуры или их произвольной комбинации) определяются путем перемножения соответствующих Р-матриц отдельных электродов (как это делается в обычной теории четырехполюсников с использованием матрицы рассеяния).



Рис. 1. к-й электрод ВШП.

Пусть задана ПАВ структура в виде электродов с чередующейся полярностью и произвольно меняющимся периодом и перекрытием соседних электродов. Будем также полагать, что источник сигнала амплитудой U_0 подключен слева. Рассмотрим k-й электрод ВШП (рис. 1, a). Пусть $R(Z, \omega)$ и $S(Z, \omega)$ — две связанные между собой плоские волны с волновым числом κ , распространяющиеся в электродной структуре ВШП. Причем $R(Z, \omega)$ распространяется в направлении оси Z, а $S(Z, \omega)$ — в направлении, противоположном оси Z. Однородные плоские волны запишем в виде

$$R(Z, \omega) = R(\omega) \exp(-j\kappa Z), \qquad (1)$$

$$R(Z, \omega) = S(\omega) \exp(+j\kappa Z), \qquad (2)$$

где $R(\omega)$, $S(\omega)$ — комплексные амплитуды соответствующих волн.

Пусть на *k*-й электрод слева падает волна $R_K(R, \omega)$, а справа — $S_{K+1}(Z, \omega)$, тогда для комплексных амплитуд прошедших волн с учетом механизмов отражения, прохождения и преобразования с коэффициентом ξ_K можно получить

$$S_{K}(\omega) = r_{K}\eta_{1K} \exp[-j(\kappa_{E} - \kappa_{0})p_{K}]R_{K}(\omega)$$

+ $\eta_{1K}(1 - |r_{K}|^{2})^{1/2} \exp(-j(\kappa_{E} - \kappa_{0})p_{K}]S_{K+1}(\omega)$
+ $\xi_{K}(\omega)\eta_{2K} \exp[-j(\kappa_{E} - \kappa_{0})p_{K}/2]U_{0},$ (3)

$$R_{K+1}(\omega) = \eta_{1K} (1 - |r_K|^2)^{1/2} \exp[-j(\kappa_E - \kappa_0)p_K] R_K(\omega) + r_K \eta_{1K} \exp[-j(\kappa_E - \kappa_0)p_K] S_{K+1}(\omega) + \xi_K(\omega) \eta_{2K} \exp[-j(\kappa_E - \kappa_0)p_K/2] U_0,$$
(4)

где r_K — комплексный коэффициент отражения от k-го электрода, κ_E — эффективное волновое число ПАВ, $\kappa_0 = 2\pi/p_K$, $p_K = Z_{K+1} - Z_K$, ξ_K — коэффициент преобразования ПАВ на k-м электроде, $\eta_{1K} = W_{1K}/W_0$, $\eta_{2K} = W_{2K}/W_0$, W_0 — максимальная апертура, W_{1K} перекрытие соседних электродов, $W_{2K} = W_0$ в случае, если используются холостые электроды, и $W_{2K} = W_{1K}$, если холостые электроды не используются. Фазовые сомножители у слагаемых, связанных с отражением (преобразованием) волн, определяют фазовый набег от центра отражения (преобразования) волны до соответствующей границы: Z_K — для $S_K(\omega)$ и Z_{K+1} — для $R_K(\omega)$. Центр отражения (преобразования) ПАВ принят находящимся в центре электрода. Эффективное волновое число вычислим как $\kappa_E = 2\pi/\lambda_E = \omega/[V_0 + L_K(V_M - V_0)/p_K] - j\alpha$, где V_0 — скорость ПАВ на свободной поверхности, V_M — скорость ПАВ под металлизированной поверхностью, α — суммарные потери при распространении ПАВ в электродной структуре на единицу длины.

Изменение тока в шине ВШП происходит за счет преобразования прямой и обратной волн и падения напряжения на емкости электрода

$$\Delta I_{K}(\omega) = I_{K}(\omega) - I_{K+1}(\omega) =$$

$$+ 2\xi_{K}(\omega) \exp[-j(\kappa_{E} - \kappa_{0})p_{K}/2]R_{K}(\omega)$$

$$+ 2\xi_{K}(\omega) \exp[-j(\kappa_{E} - \kappa_{0})p_{K}/2]S_{K}(\omega)$$

$$+ j\omega(C_{2}/2)U_{0}.$$
(5)

Рассмотрим слагаемые, связанные с преобразованием ПАВ при прохождении через электрод ВШП (рис. 1, *b*), и учтем тот факт, что возбуждение носит распределенный характер. Будем полагать, что прямое и обратное преобразование ПАВ на электродах происходит с одинаковой эффективностью, т. е. носит взаимный характер. Пусть задано распределение поверхностного тока на электродах ВШП в виде J(Z). Будем считать, что механизм преобразования ПАВ малым участком поверхностного тока ΔZ_K электрода и всего электрода аналогичны. Тогда, просуммировав вклады и преобразование ПАВ по ширине электрода относительно его центра Z_C и переходя к пределу ($\Delta Z_K \rightarrow 0$), получим

$$\xi_K = G_a \int_{-L_K/2}^{L_K/2} J(Z) \exp[-j(\omega/V_M - \kappa_0)Z] dZ, \quad (6)$$

где G_a — акустическая проводимость излучения на частоте синхронизма (см., например, [6]).

Расчет распределения поверхностного тока на электродах J(Z) в самосогласованной постановке, т.е. с учетом краевых эффектов, конечной длины ВШП и обратной реакции пьезоэлектрика, изложен в [7]. Соотношения (3)–(5) можно записать в матричной форме

$$\begin{vmatrix} S_{K}(\omega) \\ R_{K+1}(\omega) \\ \Delta I_{K}(\omega) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} P(1,1) \ P(1,2) \ P(1,3) \\ P(2,2) \ P(2,2) \ P(2,3) \\ P(3,1) \ P(3,2) \ P(3,3) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} R_{K}(\omega) \\ S_{K+1}(\omega) \\ U_{0} \end{vmatrix}.$$
 (7)

Теперь *P*-матрица ВШП в целом может быть найдена последовательным перемножением *P*-матриц, описывающих каждый электрод.

Используя систему уравнений (3)–(5) с произвольными коэффициентами, записанную для двух последовательно включенных ПАВ структур, нетрудно получить компоненты суммарной *P*-матрицы

$$P^{(s)}(1,1) = P^{(1)}(1,1) + P^{(1)}(1,2)P^{(2)}(1,1)P^{(1)}(2,1)/P_0; \quad (8)$$

$$P^{(s)}(1,2) = P^{(1)}(1,2)P^{(2)}(1,2)/P_0;$$
(9)

$$P^{(s)}(1,3) = P^{(1)}(1,3) + P^{(1)}(1,2) [P^{(2)}(1,3) +$$

$$+ P^{(2)}(1,1)P^{(1)}(2,3)]/P_0; (10)$$

$$P^{(s)}(2,1) = P^{(1)}(2,1)P^{(2)}(2,1)/P_0;$$
(11)

$$P^{(s)}(2,2) = P^{(2)}(2,2) + P^{(2)}(2,1)P^{(1)}(2,2)P^{(2)}(1,2)/P_0;$$
(12)

$$P^{(s)}(2,3) = P^{(2)}(2,3) + P^{(2)}(2,1)/P^{(1)}(2,3) + P^{(2)}(1,3)P^{(1)}(2,2)]/P_0;$$
(13)

$$P^{(s)}(3,1) = P^{(1)}(3,1) + P^{(1)}(2,1)[P^{(1)}(3,1) + P^{(2)}(1,1)P^{(1)}(3,2)]/P_0;$$
(14)

$$P^{(s)}(3,2) = P^{(1)}(3,2) + P^{(2)}(1,2) [P^{(1)}(3,2) + P^{(1)}(2,2)P^{(2)}(3,1)]/P_0;$$
(15)

$$P^{(s)}(3,3) = P^{(1)}(3,3) + P^{(2)}(3,3) + \{P^{(1)}(3,2)[P^{(2)}(1,3) + P^{(2)}(1,1)P^{(1)}(2,3)] + P^{(2)}(3,1)[P^{(1)}(2,3) + P^{(1)}(2,2)P^{2}(1,3)]\}/P_{0}, \quad (16)$$

где $P_0 = 1 - P^{(2)}(1, 1)P^{(1)}(2, 2)$; верхние индексы *s*, 1 и 2 относятся соответственно к суммарной *P*-матрице, *P*-матрице ПАВ структуры, находящейся слева, и *P*-матрице ПАВ структуры, находящейся справа; ПАВ структурой может быть как отдельный электрод, так и группа электродов, для которой вычислена суммарная *P*-матрица. Процедуру вычисления компонент *Р*-матрицы ПАВ структуры, описываемую последовательным перемножением соответствующих компонент согласно соотношениям (8)–(16), запишем в символической форме в виде

$$P(l,m) + \prod_{n=1}^{N} \mathbb{F} \{ P_n(l',m') \},$$
(17)

где N — номер последнего электрода ПАВ структуры, а под знаком функции $F\{P_n(l', m')\}$ понимается вычисление последовательных произведений компонент матрицы согласно (8)–(16).

Приведенные соотношения позволяют рассчитывать входную проводимость ВШП в составе фильтра или резонатора с произвольно меняющимся периодом и апертурой электродов вдоль структуры ВШП и реальным распределением поверхностного тока (заряда) на электродах ВШП. Отметим, что входную проводимость ВШП определяет элемент P(3, 3) суммарной *P*-матрицы ПАВ структуры.

Расчет фильтров, использующих продольные резонансные моды модифицированным СОМ-методом

Топология DMSF-фильтра [3] представлена на рис. 2. Она включает один входной преобразователь — IDT-A и два выходных преобразователя — IDT-B и IDT-C, включенных параллельно. Отметим, что возможно использование и одного выходного ВІШП вместо двух. Для обеспечения оптимального режима возбуждения резонансных мод в полости резонатора по краям IDT-B и IDT-C включены отражающие структуры RA-B и RA-C.

Расчет DMSF-фильтра будем проводить на основе модифицированного COM-метода. Эквивалентную акустоэлектрическую схему DMSF представим, рассматривая каждый ВШП в виде устройства с двумя электрическими и четырьмя акустическими входами (выходами), как это показано на рис. 3. К преобразователям IDT–A, IDT–B и IDT–C приложены потенциалы U^A , U^B , U^C , через них текут токи I^A , I^B , I^C соответственно. На преобразователи IDT–A, IDT–B и IDT–C слева падают акустические волны с комплексными амплитудами R^{A1} , R^{B1} , R^{C1} и



Рис. 2. Топология фильтра на продольных резонансных модах.



Рис. 3. Эквивалентная акустоэлектрическая схема преобразователей DMSF-фильтра.



Рис. 4. Эквивалентная акустоэлектрическая схема DMSF-фильтра.

отражаются акустические волны с комплексными амплитудами S^{A1} , S^{B1} , S^{C1} , а справа падают акустические волны с комплексными амплитудами S^{B2} , S^{A2} , S^{C2} и отражаются акустические волны с комплексными амплитудами R^{B2} , R^{A2} , R^{C2} соответственно.

Записывая уравнения аналогичные уравнениям (3)-(5)для *k*-го электрода IDT–А-фильтра, а затем, выполняя последовательное перемножение компонент матриц согласно (8)-(16), получим компоненты матрицы P^A , описывающей преобразователь IDT–А,

$$\begin{vmatrix} S^{A1}(\omega) \\ R^{A2}(\omega) \\ I^{A}(\omega) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} P^{A}(1,1) & P^{A}(1,2) & P^{A}(1,3) \\ P^{A}(2,2) & P^{A}(2,2) & P^{A}(2,3) \\ P^{A}(3,1) & P^{A}(3,2) & P^{A}(3,3) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} R^{A1}(\omega) \\ S^{A2}(\omega) \\ U^{A} \end{vmatrix}.$$
 (18)

Компоненты матриц P^B и P^C , описывающих преобразователи IDT–В и IDT–С соответственно, вычислим с учетом расположенных слева и справа отражающих структур RA–В и RA–С. Преобразователь IDT–В, включающий отражающую структуру RA–B, обозначим как IDT–RB, а преобразователь IDT–С, включающий отражающую структуру RA–C, обозначим как IDT–RC. Принцип нахождения суммарных *P*-матриц преобразователей IDT–RB и IDT–RC продемонстрирован на рис. 3. При нахождении последовательных произведений компонент матриц отдельных электродов согласно (8)–(16) учтем, что для отражающих структур $\xi_K = 0$, U = 0, $C_2 = 0$, при этом элементы матри-

цы P(1, 3), P(2, 3), P(3, 1), P(3, 2), P(3, 3) будут нулевыми.

Заметим также, что *P*-матрица, описывающая зазор между ВШП и ОС (отражательной структурой) или между двумя ВШП, может быть получена из соотношений (3)–(5) при условиях $\xi_K = 0$, $U_0 = 0$, $C_2 = 0$, $r_K = 0$, $W_K = 0$. В данном случае ненулевыми будут только элементы *P*-матрицы P(1, 2) и P(2, 1). Из рассмотрения рис. З понятно, что $R^{RB1} = R^{RB2} \exp(-j\kappa d)$, $S^{RC2} = S^{RB1} \exp(j\kappa d)$ и $R^{RC1} = R^{RC2} \exp(-j\kappa d)$, $S^{RC2} = S^{RC1} \exp(j\kappa d)$, где d — расстояние между ОС и ВШП. Тогда компоненты матрицы P^{BR} , описывающей преобразователь IDT-В с учетом отражающей структуры RA-B, можно записать как

$$\begin{vmatrix} S^{B1}(\omega) \\ R^{B2}(\omega) \\ I^{B}(\omega) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} P^{BR}(1,1) & P^{BR}(1,2) & P^{BR}(1,3) \\ P^{BR}(2,2) & P^{BR}(2,2) & P^{BR}(2,3) \\ P^{BR}(3,1) & P^{BR}(3,2) & P^{BR}(3,3) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} R^{B1}(\omega) \\ S^{B2}(\omega) \\ U^{B} \end{vmatrix}.$$
(19)

Аналогично можно получить компоненты матрицы *P^{CR}*, описывающей преобразователь IDT–C с учетом отражающей структуры RA–C,

$$\begin{vmatrix} S^{C2}(\omega) \\ R^{C1}(\omega) \\ I^{C}(\omega) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} P^{CR}(1,1) & P^{CR}(1,2) & P^{CR}(1,3) \\ P^{CR}(2,2) & P^{CR}(2,2) & P^{CR}(2,3) \\ P^{CR}(3,1) & P^{CR}(3,2) & P^{CR}(3,3) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} R^{C2}(\omega) \\ S^{C1}(\omega) \\ U^{C} \end{vmatrix}.$$
(20)



Рис. 5. Эквивалентная электрическая схема DMSF-фильтра.

Окончательно с учетом проведенных преобразований эквивалентную схему DMSF-фильтра представим в виде, показанном на рис. 4.

Соответствующие эквивалентной акустоэлектрической схеме, представленной на рис. 4, системы уравнений (18)–(20) описывают комплексные амплитуды падающих и прошедших волн, а также комплексные амплитуды токов, текуших через преобразователи. Заметим, что $R_{B1} = 0$, $S_{C2} = 0$ и $R_{A1} = R_{B2} \exp(-j\kappa d_1)$, $S_{B2} = S_{A1} \exp(j\kappa d_1)$ и $R_{C1} = R_{A2} \exp(-j\kappa d_1)$, $S_{A2} = S_{C1} \exp(j\kappa d_1)$, где d_1 — расстояние между IDT–А и IDT–BR, d_2 — расстояне между IDT–А и IDT–CR.

Решая системы уравнений (18)–(20) относительно неизвестных токов можно получить

$$\begin{cases} I^{A} = U^{A}Y^{A} + U^{B}Y^{AB} + U^{C}Y^{AC} \\ I^{B} = U^{A}Y^{BA} + U^{B}Y^{B} + U^{C}Y^{BC} \\ I^{C} = U^{A}Y^{CA} + U^{B}Y^{CB} + U^{C}Y^{C} \end{cases},$$
(21)

где величины Y^A , Y^{AB} , Y^{AC} , Y^{BA} , Y^B , Y^{BC} , Y^{CA} , Y^{BC} , Y^C имеют смысл проводимостей и находятся из решения систем уравнений (18)–(20).

Эквивалентная электрическая схема фильтра, соответствующая системе уравнений (21), представлена на рис. 5. Используя эквивалентную электрическую схему фильтра и величины входных проводимостей из системы (21), можно расчитать S-параметры фильтра.

Фильтр, топология которого приведена на рис. 2, а эквивалентная электрическая схема — на рис. 5, обеспечивает небольшое внеполосное подавление ($\sim -30 \, dB$ при уровне "плеча" $-10 \ldots -15 \, dB$), поэтому для практического использования необходимо включить не менее двух звеньев последовательно.

Результаты проектирования DMSF-фильтра

Для экспериментальной проверки разработанной теории был спроектирован, а затем изготовлен фильтр на центральную частоту 95.5 MHz, и полосу рабочих частот 3.5 MHz. Эквивалентная электрическая схема фильтра с двумя последовательно включенными звеньями приведена на рис. 6. Отметим, что фильтр имеет четыре полюса входной проводимости.

В соответствии с требуемой полосой рабочих частот фильтра в качестве материала пьезоподложки был выбран 36° LiTaO₃ [1]. Основные параметры топологии фильтра следующие: апертура ВШП $45\lambda_0$; полупериод преобразователей IDT-A, IDT-B, IDT-C одинаков и равен 10.3 µm; преобразователь IDT-А состоял из 39 электродов, преобразователи IDT-В и IDT-С состояли из 27 электродов каждый, отражающая структура RA-В состояла из 130 электродов, а RA-С — из 90 электродов. В качестве электродов преобразователей и отражающей структуры использовалась четырехслойная структура. Непосредственно на пьезоподложку магнетронным распылением в вакууме наносился подслой ванадия толщиной 0.01 µm, затем последовательно слой алюминия толщиной 1.15 µm, подслой ванадия толщиной 0.01 µm и слой меди толщиной 0.5 µm. При расчете частотных характеристик фильтра были использованы зависимости *r_K(h)* и квадрата коэффициента электромеханической связи $k^{2}(h)$ (необходимой для расчета Ga), полученные на основе данных, проведеных в работе [8]. Потери в структуре α были приняты равными 0.005 dB/ λ .

Результаты расчета частотной зависимости коэффициента передачи фильтра (S21) в 50-омном тракте, проведенные изложенным методом, приведены на рис. 7, *а.* Результаты измерения S21 прибором К4-37 представлены на рис. 7, *b*. По результатам расчета минимальные потери в полосе рабочих частот составили 0.8 dB, а по результатам измерений — 2.5 dB. Различие в расчетном и экспериментальном значениях минимальных вносимых потерь, по-видимому, связано с пренебрежением



Рис. 6. Эквивалентная электрическая схема двухзвенного DMSF-фильтра, используемого в стандарте GSM.

87



Рис. 7. Результаты расчета (*a*) и измерения (*b*) коэффициента передачи DMSF-фильтра.



Рис. 8. Топология и эквивалентная электрическая схема гибридного DMSF-LADDER-фильтра с повышенным внеполосным подавлением.

при расчете резистивными потерями и электродах на рабочих частотах фильтра. Провышенная изрезанность экспериментальной характеристики в области "плеча" связана с недостаточной точностью позиционирования элементов топологии при изготовлении фотошаблона, которая составляла ~ 1.5...2 µm.

Гибридный DMSF-LADDER-фильтр

Недостатком четырехполюсного DMSF-фильтра является наличие справа на его частотной зависимости коэффициента передачи "плеча" на уровне примерно -30 dB. В работах [4,5] был предложен способ уменьшения данного недостатка путем включения емкости между входом и выходом. Однако при введении емкости наряду с увеличением уровня внеполосного подавления в области "плеча" имеет место и уменьшение общего уровня внеполосного подавления вне области "плеча". В данной работе предлагается топологический метод устранения "плеча" путем использования лестничного фильтра на основе резонаторов на ПАВ вместо второго звена DMSF-фильтра. Общее число полюсов входной проводимости при этом сохраняется и равно четырем. На рис. 8, а приведена топология гибридного DMSF-LADDER-фильтра, а на рис. 8, *b* — его эквивалентная электрическая схема. При одинаковом числе полюсов входной (выходной) проводимости фильтров, выполненных по предлагаемой топологии и по ранее предложенным топологиям [3-5], первый имеет лучшее внеполосное подавление, в том числе и в области "плеча". Параметры топологии резонаторов, входящих в лестничный фильтр, были выбраны на основе метода синтеза лестничных фильтров, предложенного в работе [1]. Для получения оптимальной частотной характеристики гибридного фильтра полоса пропускания лестничного фильтра должна располагаться там же, где и полоса



Рис. 9. Результаты расчета обычного DMSF-фильтра стандарта GSM (1) и гибридного DMSF-LADDER-фильтра, топология которого представлена на рис. 8 (2).

пропускания одного звена DMSF, а входной (выходной) импеданс лестничного фильтра должен быть согласован со входным (выходным) импедансом DMSF-фильтра.

В качестве материала пьезоподложки был выбран 36° LiTaO₃. Основные параметры топологии звена DMSF следующие: апертура $65\lambda_0$; полупериод IDT-A, IDT-В, IDT-С одинаков и равен $1.0 \mu m$; IDT-А, состоял из 39 электродов, IDT-В и IDT-С состояли из 27 электродов каждый, отражающие структуры RA-В и RA-С состояли из 125 и 85 электродов соответственно; в качестве материала электродов использовалась алюминиевая пленка толщиной 0.34 µm. Для лестничной части гибридного фильтра были использованы следующие значения параметров топологии резонаторов: преобразователь резонатора из последовательного плеча (RP) имел период 0.975 периода IDT-А и состоял из 151 электрода при апертуре $41\lambda_0$, преобразователь резонатора из последовательного плеча (RS) имел период 1.018 периода IDT-А и состоял из 157 электродов при апертуре 21_{λ0}. В каждой отражающей структуре резонаторов RP и RS было использовано по 120 электродов. Отношение периода отражающей структуры к полупериоду преобразователя для резонатора RP составляло 1.015, а для резонатора RS — 0.985. Потери в структуре а были приняты равными 0.02 dB/λ. Отметим, что вся конструкция размещена на одной подложке.

На рис. 9 приведены результаты расчета предложенным методом коэффициента передачи обычно используемого в стандарте GSM-фильтра на 947 MHz (кривая 1), состоящего из двух последовательно включенных звеньев типа приведенного на рис. 2. Там же (кривая 2) приведены результаты расчета подобного фильтра, у которого одно звено исключено, а на входе и выходе оставшегося звена включены Т-образные лестничные фильтры, состоящие из резонаторов на ПАВ. Как видно из рис. 9, уровень подавления "плеча" увеличился на 20 dB, кроме того, увеличился уровень внеполосного подавления слева в непосредственой близости от полосы пропускания фильтра.

Аналогичные результаты можно получить при использовании вместо Т-образного лестничного фильтра *п*-образный лестничный фильтр или их комбинацию.

Заключение

Предложенные в работе гибридный резонаторный фильтр на ПАВ благодаря сочетанию свойств лестничных фильтров и фильтров на продольных резонансных модах имеет хорошее внеполосное подавление (более 50 dB) во всем диапазоне частот — как вблизи полосы пропускания, так и при значительной отстройке от центральной частоты.

В качестве части гибридного фильтра, представляющей собой фильтр на продольных резонансных модах, могут быть использованы как фильтры, состоящие из двух ВШП, так и фильтры, состоящие из трех ВШП.

В качестве лестничной части гибридного фильтра могут быть использованы звенья различных типов. При оптимальном подборе параметров топологии они дают незначительно отличающиеся значения неравномерности вносимых потерь в рабочей полосе частот и коэффициента стоячей волны по напряжению. Однако, как показал анализ, оптимальным типом звена лестничного фильтра для включения на входе и выходе DMSFфильтра является звено T-типа.

Список литературы

- [1] Дмитриев В.Ф. // ЖТФ. 2002. Т. 72. Вып. 8. С. 95–102.
- [2] Dmitriev V.F., Osipova N.P. // Proc. International Forum on Wawe Electronics and Its Application. St.Peretsburg, 2000. P. 360–364.
- [3] *Morita T., Watanabe Y., Tanaka N.* et al. // Proc. IEEE Ultrasonics Symposium. 1992. P. 95–104.
- [4] Beaudin S., Damphousse S., Cameron T. // Proc. IEEE Ultrasonics Symposium. New York. P. 389–393.
- [5] Campbell C.K., Edmondson P.J. // IEEE Trans. on UFFC-48. 2001. Vol. UFFC-48. N 5. P. 1298–1301.
- [6] Birykov S.V., Martin G., Polevoi V.G. et al. // IEEE Trans. on UFFC-42. 1995. Vol. UFFC-42. N 4. P. 612–618.
- 7] Дмитриев В.Ф. // ЖТФ. 2002. Т. 72. Вып. 9. С. 93–101.
- [8] Rosler U., Cohrs D., Dietz A. // 1995 IEEE Ultrasonics Symposium. P. 247–250.